# Heuristiken für das TechnologyMapping

Alexander Zorn

Geboren am 26. Mai 1996 in Bonn 14. Juni 2018

Bachelorarbeit Mathematik

Betreuer: Prof. Dr. Stephan Held

Zweitgutachter: YYYY YYYY

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR DISKRETE MATHEMATIK

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN

# Inhaltsverzeichnis

1	Ein	leitung	2
2	Ter	minologie & grundlegender Algorithmus	3
	2.1	grundlegende Definitionen	3
	2.2	Kern Algorithmus	5
3	Allg	gemeiner Algorithmus	8
	3.1	Tradeoffprobleme	8
	3.2	Highfanoutknoten	9
	3.3	zu lange Kanten	12
	3.4	Teilweise überflüssige Subcircuits	13
	3.5	FPTAS und Heuristik	14
		3.5.1 Matching Suche in polynomieller Zeit	14
		3.5.2 Filtern mit Buckets	14
		3.5.3 FPTAS	15
		3.5.4 Heuristik	16
	3.6	required Arrivaltimes	16
	3.7	pinabhängiges Delay	18
	3.8	Mehrere Outputs	18
	3.9	Allgemeiner Algorithmus	20
4	Pre	mapping von Highfanoutknoten	21
	4.1	triviales Premapping	22
	4.2	erweiteretes Premapping	22
	4.3	Premapping durch Schätzen	22
5	Prä	prozessing zusätzliche Addons	23
6	Wei	itere Optimierungskriterien	23
7	Ver	sion der Heuristik, welche obige Kriterien beherzigt	24
8	Res	source Sharing	24
9	Lau	fzeitanalyse	25
	9.1	Struktur realer Instanzen	25
	9.2	Analyse der Ergebnisse	25
	9.3	Laufzeitanalyse	26
10	Fazi	it und Ausblick	26

### 1 Einleitung

Der zunehmende Gebrauch elektronischer Geräte verlangt nach immer leistungsfähigeren Computerchips. Ein solcher wenige Quadratzentimeter große Chip beherbergt bis zu mehreren Milliarden Transistoren, welche, durch Drähte verbunden, gemeinsam eine Logische Funktion errechnen. Das Chipdesign beschreibt die Aufgabe aus einer gegeben Logischen Funktion einen herstellbaren Chip zu entwerfen, welcher diese Funktion realisiert.

Mithilfe von, aus wenigen Transistoren konstruierten, Bauteilen (genannt Gates, z.B.: AND, OR, INV, OAI) lässt sich eine Logische Funktion nachbilden. Abbildung 1 (links) zeigt dies an einem kleinen Beispiel. Die Realisierung einer solchen Funktion ist jedoch nicht eindeutig, wie die in Abbildung 1 (links und rechts) gezeigte Nachbildung, beweist.

Die Größe der Menge aller möglicher Baupläne (später Circuit) für eine Logische Funktion hängt maßgeblich

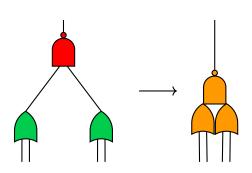


Abbildung 1: Zwei Realisierungen der Logischen Funktion  $\neg((w \lor x) \land (y \lor z))$ 

von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Bauteile, sowie von dem Aufbau der Funktion, ab. Es stellt sich heraus, dass im Allgemeinen eine Vielzahl möglicher Realisierungen einer Logischen Funktion existieren. Jedes Bauteil besitzt physikalische Eigenschaften an Größe, Geschwindigkeit (Delay) etc.. Somit besitzt auch jede Realisation solche Eigenschaften.

Ziel des TechnologyMappingist es für eine Logische Funktion eine Realisierung zu finden, welche eine Kostenfunktion (bestehend aus den physikalischen Eigenschaften) optimiert. Die Wahl der Implementierung hat direkte Auswirkungen auf die Schnelligkeit, Größe und den Stromverbrauch des fertigen Chips. Hierbei geht das TechnologyMappingvon einer bereits realisierten Logischen Funktion aus und baut diese um zu einer möglichst kostengünstigen Alternative um.

Der optimale mögliche Umbau lässt sich bei kleinen oder eingeschränkten gegebenen Bauplänen noch in akzeptabler Zeit finden. Die Lösung dieses Problem für allgemeine Baupläne und Kostenfunktionen ist jedoch ein NP vollständiges Problem. Aus diesem Grund entwickelt die folgende Arbeit eine Heuristik, welche für sehr (mehrere 10.000 Bauteile) große Baupläne in akzeptabler Zeit einen möglichst kostengünstigen Umbau ermöglicht.

am ende hier noch eine kurze Quellenübersicht geben an lukas orientiert

### 2 Terminologie & grundlegender Algorithmus

### 2.1 grundlegende Definitionen

Es folgen ein paar grundlegende Definitionen zur Beschreibung des Problems.

#### **Definition 2.1.** Boolesche Variable und Funktion:

Eine boolesche Variable ist eine Variable mit Werten in  $\{0,1\}$ . Sei  $n,m \in \mathbb{N}$ . Eine boolesche Funktion ist eine Funktion  $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$  mit n Inputs und m Outputs.

#### **Definition 2.2.** Gate und Library:

Ein Gate g mit Eingangsgrad  $n \in \mathbb{N}$  ist ein Tripel  $(f_g, d_g, area_g)$ . Hierbei sind  $d_g, area_g \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ . Des Weiteren gilt  $f_g$  ist eine boolesche Funktion mit  $f_g : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ .

Eine Library L ist eine Menge von Gates und sei  $fanin_{max} := max\{arity(g)|g \in L\}.$ 

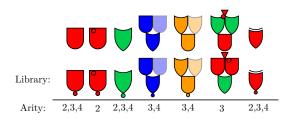


Abbildung 2: Beispiel einer Library

 $area_g$  gibt die Größe des physikalischen Bauteils an und  $d_g$  beschreibt die Zeit die ein Signal braucht um von den inputs des Gates zu seinem Output zu gelangen. Dieser Wert lässt sich noch weiter differenzieren indem man  $d_g \in \mathbb{R}^n$  wählt und somit Zeiten für jeden der Inputs angeben werden kann. Hierauf wird jedoch erst in Kapitel 3 eingegangen.

Wenn die Signale der Inputs nicht zur selben Zeit ankommen wird, falls nicht anderes angegeben, gewartet bis das letzte Signal das Gate erreicht.

#### **Definition 2.3.** Circuit:

Ein Circuit ist ein gerichteter kreisfeier Graph (directed acyclic graph DAG) mit folgenden Eigenschaften. Jeder Knoten gehört zu einer der aufgelisteten Kategorien:

- Input Knoten mit Eingangsgrad Null.
- Gates mit mindestens einer eingehenden Kante und ausgehenden Kante. Diese korrespondieren zu der Definition oben mit dem Zusatz dass an jedem der Inputs optional ein Inverter liegen kann.

• Outputs mit genau einer eingehenden Kante und keiner ausgehenden.

Ein Gate mit mehr als einer ausgehenden Kante wird auch Highfanoutgate genannt.

Ein Circuit realisiert durch Verschachtelung der booleschen Funktionen seiner Gates ebenfalls eine boolesche Funktion.

Zwei Circuits heißen äquivalent, wenn sie die gleiche boolesche Funktion realisieren.

In einem Circuit lassen sich Teilgraphen durch ein Gate der Library austauschen. Voraussetzung für einen solchen Tausch ist, dass der veränderte Circuit äquivalent zu dem originalen ist. Dies formalisieren die folgenden Definitionen.

#### **Definition 2.4.** Match und Kandidat:

Sei g ein Gate in einem Circuit C. Ein (invertiertes) Match m ist ein Tupel  $(p_m, I_m, f_m, inv_m)$  welches folgendes enthält:

- Ein Gate p der Library
- Eine Menge X von Knoten aus der Circuit und eine Bijektion  $f: X \to inputs(p)$
- Ein Funktion  $inv: inputs(p) \rightarrow \{not\_inv, inv\}$

So dass der Circuit C', welcher durch den Austausch des Sub-Circuits von X bis g durch das Match (mit den durch inv definierten Invertern an den Inputs) entsteht, äquivalent zu C ist. Ein invertiertes Match auf g ist ein Match auf g mit einem Inverter an jedem seiner Outputs.

Ein (invertierter) Kandidat auf g besteht aus einem (invertierten) Match auf g und einem Kandidaten für jeden Input Knoten von g (welcher kein Input von C ist).

### **Definition 2.5.** Circuit-Kandidat:

Sei C ein Circuit mit Outputknoten Menge O. Eine Circuit-Kandidat K von C ist eine Menge von Kandidaten, sodass  $\forall o \in O \exists ! h \in K : h$  ist Kandidat von o und an jedem Knoten von C an dem sich mehrere Kandidaten überschneiden ist dasselbe Match gewählt.

Abbildung 3 visualisiert die vorherigen Definitionen.

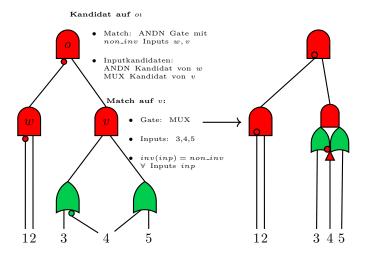


Abbildung 3: Beispiel einer Library

Ein Circuit-Kandidat C ist eine Möglichkeit den Circuit physikalisch zu realisieren. Wie bereits in der Einleitung bemerkt gilt es nun den besten Kandidaten auf C auszuwählen. Dafür ist ein Maß für Implementierungen von Circuits notwendig. Es folgen zwei geläufige Beispiele. In der Praxis (und im späteren Verlauf dieser Arbeit) wird in der Regel eine convex-Kombination aus beiden verwendet.

**Definition 2.6.** Area und Delay eines Kandidaten: Sei C ein Circuit und K ein Circuit-Kandidat auf C. Dann gilt:

• 
$$area(K) = \sum_{g \in gates(C)} (a_g + \sum_{i \in inputs(g)} \mathbb{1}_{inv_g(i)} area_{inv})$$

$$AT(K) = \max_{k \in can(K)} \{ \max_{i \in inputs(k)} \{ d_{gate(k)} + \mathbb{1}_{inv_g(i)} d_i + AT(inp\_can(k, i)) + d_{w(k, i)} \} \}$$

Wobei can(K) die Menge der Kandidaten von K sind,  $area_{inv}$  die Größe eines Inverters ist und inputs(k) sind die Inputknoten des Outputknoten des Kandidaten k. Des Weiteren ist  $d_i$  das Delay eines Inverters und  $d_{w(k,i)}$  das Delay der Kante zwischen den Knoten k und i.  $inp\_can(k,i)$  gibt den Kandidaten des i'ten Inputs von k zurück.

Das Delay (AT) gibt an, wann das letzte Signal aus einem der Outputs des Circuit kommt.

### 2.2 Kern Algorithmus

Es folgt ein grundlegender Algorithmus, welcher auf eingeschränkten Circuits arbeitet, jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu einer Heuristik für allgemeine sehr große Circuits erweitert wird.

### (EINFACHES) TECHNOLOGY MAPPING

**Instanz:** Circuit C ohne Highfanoutknoten (Knoten mit nur einer aus-

gehenden Kante), mit eindeutigem Output o, Library L mit

beschränktem  $fanin_{max}$ 

**Aufgabe:** Finde einen Kandidaten K auf o, welcher die Arrivalti-

me/Area minimiert.

### Algorithmus: (einfaches) Technology Mapping

Input: Circuit C kreisfrei mit finalem Output o, Library L

1 bester\_kandidat[]  $\leftarrow \emptyset$ 

ry.

- **2** bester\_inv\_kandidat[]  $\leftarrow \emptyset$
- **3 foreach** Knoten  $v \in V(G)$  in topologischer Reihenfolge **do**
- berechne alle (invertierten) Matches auf v
- **foreach** Match m auf v do
- $\mathbf{6}$  Berechne besten Kandidaten mit m auf v
- 7 Update best\_(inv)\_kandidaten
- 8 Implementiere C entsprechend bester\_kandidat[o]

#### **Definition 2.7.** optimaler TechnologyMappingAlgorithmus:

Ein Algorithmus für das Technology Mappingauf einem Circuit C heißt optimal, wenn er den (bzgl. der Kostenfunktion) besten äquvalenten Circuit C' liefert, welcher durch das Anwenden der erlaubten Operationen auf C konstruiert werden kann.

Daraus folgt, dass der Zusatz optimal abhängig davon ist, was die erlaubten Operationen sind. Im Weiteren Verlauf der Arbeit werden weitere Operationen hinzugefügt und der Circuit verallgemeinert. Das Attribut optimal bezieht dann, wenn dies nicht dabei steht, auf alle bisher vorgestellten Operationen. Zu diesem Punkt umfasst die Menge der erlaubte Operationen das logische äquvalente matchen von Subcircuits mit Elementen der Libra-

Ein optimaler Technology MappingAlgorithmus liefert in der Regel nicht die bestmögliche Implementierung der C zugrunde liegenden logischen Funktion. Dies veranschaulicht Abbildung 4. In diesem Beispiel ist die zugrundeliegende Funktion konstant und somit könnte man auf alle Gates verzichten. Dies ist jedoch mit den bisher eingeführten Möglichkeiten des Technology Mappingnicht

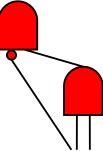


Abbildung 4: Ein Circuit desen boolesche Funktion f = 0 ist

möglich.

### Korollar 2.8. Das einfache TechnologyMappingist optimal.

Beweis. Der Algorithmus geht in topologischer Reihenfolge durch die Knoten v des Graphen und berechnet alle Matche auf v. Diese werden dann zu einem Kandidaten ergänzt. Ohne Highfanout-Knoten überschneiden sich diese nicht. Für jeden Knoten und jedes Match gibt es nur einen Kandidaten zur Auswahl, da für die Inputs des Matche jeweils nur ein Kandidat gespeichert wurde. An jedem Knoten wird nur das Match (mit dem dazugehörigen Kandidaten) gespeichert, welches die Kosten optimiert.

Es bleibt zu zeigen, dass angenommen für alle Knoten mit kleinerem topologischen Rang als rand(v) ist der bestmögliche Kandidat gespeichert, so wird, nach gerade beschriebenem Vorgehen, auch für v der schnellste (bzw. kleinste) Kandidat k gespeichert.

Angenommen es gibt einen besseren Kandidaten k', als k, welcher von dem Algorithmus gespeichert wurde. Sei k'' der Kandidate, welcher dasselbe Match wie k' benutzt und die besten Input Kandidaten. Da k'' die besten Input Kandidaten benutzt ist er mindestens so schnell (bzw. klein) wie k'. k ist jedoch ebenfalls mindestens so kostengünstig wie k'' (andernfalls hätte der Algorithmus k'', k vorgezogen). Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.

### **Korollar 2.9.** Der Algorithmus für das (einfache) Technology Mapping besitzt $\mathcal{O}(|V(C)||L|)$ -Laufzeit

Beweis. Schritt 1 und 2 besitzen Laufzeit  $\mathcal{O}(1)$ . Schritt 4 lässt sich, aufgrund von einem beschränkten  $fanin_{max}$  und ohne Highfanoutgates, in  $\mathcal{O}(fanin_{max}!)$  errechnen. Da  $fanin_{max}$  als beschränkt gegeben ist, entspricht dies  $\mathcal{O}(1)$ . Beweis? Schritt 6 ist, wie bereits erwähnt, schnell implementierbar, da für jeden der max  $fanin_{max}$  Inputs nur der beste Kandidat verlinkt werden muss. Ein Invertiertes Match wird nur gebraucht wenn der korrespondierende Input des darüber liegenden Gates invertiert ist. Schritt 6 lässt sich somit in  $\mathcal{O}(fanin_{max})$  realisieren. Schritt 3 und 5 sind zwei verschachtelte Schleifen mit |V(C)| und max |L| Durchläufen.

Daraus folgt eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(|V(C)||L|)$ .

### 3 Allgemeiner Algorithmus

### 3.1 Tradeoffprobleme

Der oben vorgestellte Algorithmus ist in der Lage den bestmöglichen Umbau eines eingeschränkten Circuits zu bezüglich Area oder Delay zu errechnen. Es existiert ein Tradeoff zwischen Area und Delay. Dies hat zur Folge, dass ein möglichst kleiner Circuit im Allgemeinen sehr langsam ist und man bei einer sehr schnellen Lösung mit einem großen Platzverbrauch rechnen muss. In der Anwendung des TechnologyMappingist jedoch weder ein sehr langsamer noch ein besonders grosser Circuit akzeptabel.

Daraus folgt die Nachfrage nach einem Algorithmus, welcher in der Lage ist bezüglich einer Konvexkombination oder einer Schranke zu optimieren. Daraus ergeben sich die beiden folgenden Optimierungs-Probleme:

#### TECHNOLOGYMAPPINGMIT KONVEXKOMBINATION

Instanz: Circuit C, mit einem Output, Library L mit beschränktem

 $fanin_{max}$ , |L| beschränkt und Tradeoff-Parameter  $\lambda \in [0, 1]$ 

**Aufgabe:** Finde einen Circuit-Kandidaten K auf C, welcher  $\lambda AT(K)$ +

 $(1 - \lambda)area(K)$  minimiert.

#### TechnologyMappingmit Arrivaltimeschranke

Instanz: Circuit C,mit einem Output, Library L mit beschränktem

 $fanin_{max}$ , |L| beschränkt und Arrivaltimeschranke  $A_{max}$ 

**Aufgabe:** Finde den kleinsten Circuit-Kandidaten K auf C, für den

 $AT(K) \leq A_{max}$  gilt, oder entscheide, dass für jeden Circuit-

Kandidaten K bereits  $AT(K) > A_{max}$  gilt.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels, werden diese Problemstellungen auf Circuits mit mehreren Outputs erweitert.

Diese diese Probleme sind äquvalent Beweis? oder verweis aus quelle erwähnen dass da die äquivalent nur noch Konvexkombination

Dadurch ergibt sich folgende Problemstellung für den Algorithmus: Angenommen an jedem Knoten v würde, wie im Kern-Algorithmus, nur derjenige Kandidat gespeichert werden, welcher die Kostenfunktion an v optimiert. Dadurch kann nicht mehr garantiert werden, dass beim errechnen der Kandidaten für den Output, der für ihn optimale Kandidat noch vorhanden ist. Beide Inputs getrennt nach der Kostenfunktion zu optimieren, garantiert also nicht das optimale Ergebnis.

Die Kosten eines Kandidaten k sind somit nicht  $\lambda AT(k) + (1-\lambda)area(k)$ , sondern das Tupel (AT(k), area(k)). Es gibt jedoch eine Klasse von Kandidaten, welche nicht gespeichert muss. Dazu folgende Definition

### **Definition 3.1.** (dominierte Kandidaten)

Seien  $k_1, k_2$  Kandidaten desselben Knotens. Dann wird  $k_1$  von  $k_2$  dominiert, wenn gilt:

$$AT(k_1) < AT(k_2)undarea(k_1) \le area(k_2)$$
  
 $AT(k_1) \le AT(k_2)undarea(k_1) < area(k_2)$ 

Eine optimale Lösung des TechnologyMappingverwendet offenbar (in einem Korollar beweisen ?) nur nicht-dominierte Kandidaten, woraus folgt, dass nur diese während der Ausführung des Algorithmus gespeichert werden müssen.

Die Menge der noch bleibenden Kandidaten lassen sich in sogenannten Tradeoff-Kurven speichern (s. Abb. 5). Welche jeden Kandidaten zweidimensional anhand seiner Kosten erfasst.

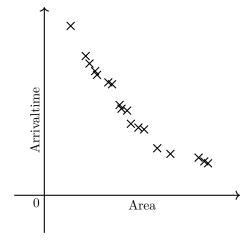


Abbildung 5: Ordnen der Kandidaten in einer Tradeoffkurve

Die beiden vorgestellten Probleme sind NP-vollständig. Daraus folgt, dass sich ab diesem Punkt wahr-

scheinlich kein polynomieller optimaler Algorithmus für das Technology-Mappingfinden lässt. Dadurch dass sich zwei Kandidaten in den meisten Fällen nicht mehr vergleichen lassen, wird eine Vielzahl von Kandidaten an jedem Knoten gespeichert. Dies zeigt sich in einem exponentiell großen Speicheraufwand.

Ein Beweis der NP-vollständigkeit findet sich in hier den verweis zu einem Beweis einfügen.

#### 3.2 Highfanoutknoten

Der oben beschriebene Kern Algorithmus arbeitet nur auf Circuits, in denen keine Highfanoutknoten existieren. Diese Eigenschaft kommt auf einem realen Chip jedoch sehr häufig vor(ca. 25% der gesamten Knoten sind Highfanoutknoten für einen genaueren Zusammenhang von der Anzahl der Highfanoutknoten und der Laufzeit siehe das Kapitel 9).

Es ist möglich einen Circuit, in kleinere Subcircuits zu unterteilen, welche solche Highfanoutknoten nicht besitzen. Die Subcircuits werden einzeln mit dem Algorithmus (sehr schnell) optimiert und daraufhin zu einem C äquivalenten Circuit C' zusammengesetzt. Diese Vorgehensweise findet sich ausführlich in Hier das eine Paper einsetzen wieder. Abbildung 6 verbildlicht diesen Ansatz einer Heuristik. Der Anteil an Highfanoutknoten

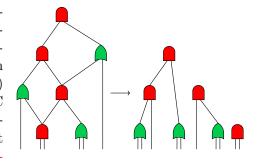


Abbildung 6: Unterteilen eines Circuit in Highfanoutfreie Subcircuits

ist auf den mir vorliegenden Chips so groß, dass eine Vielzahl sehr kleiner Subcircuits entsteht, woraus folgt, dass die Möglichkeiten des Technology-Mappingsehr eingeschränkt werden. Aus diesem Grund werde ich auf diese Art der Heuristik nicht mehr eingehen.zu anna gibt es sonst noch einen grund dies nicht doch einmal auszuprobieren?

Klonen erwähnen? (aktuell wird sie nicht erwähnt (mit beispiel bild? machen! in der definition des Circuit Kandidaten wurde das extra weggelassen

Das Kern-Problem der Highfanoutknoten ist, dass bei der Konstruktion des äquivalenten Circuits die eingebauten Kandidaten aller Nachfolger eines Highfanoutknoten v an v übereinstimmen müssen. Daraus folgt, das bei der Wahl eines Kandidaten für einen Knoten w die Wahl der Kandidaten der Input-Kandidaten von w nicht unabhängig von einander sein muss.

Abbildung 7 zeigt zudem ein weiteres Problem der Implementierung auf. Die Anzahl der zu Speichernden Kandidaten kann, mit beliebig vielen

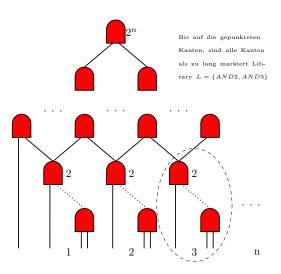


Abbildung 7: Exponentiell viele Kandidaten bereits bei sehr eingeschränkter Library

Highfanoutknoten in C, exponentiell bezüglich |V(C)| sein. Daraus folgt ein Implementierungsproblem, auf welches im Weiteren Verlauf dieser Arbeit noch eingegangen wird.

Zur Lösung des ersten Problems helfen die folgenden Definitionen:

#### **Definition 3.2.** Cone eines Knoten:

Sei C ein Circuit und v ein Knoten von C. Dann sei die Cone von v:

$$cone(v) := C[V \cup \{v\}], V = \{w \in V(C) : \exists \text{ w-v-Weg in } C\}$$

#### Definition 3.3.

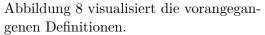
Sei C ein Circuit und  $v \in V(C)$ . Dann wird die durch cone(v) berechnete Funktion. Die **bis v berechnete Funktion** genannt.

#### **Definition 3.4.** Offene Knoten:

Sei C ein Circuit und  $v, w \in V(C)$ . Dann heißt w offener Knoten von v, wenn folgendes gilt:

- $w \in cone(v) \setminus \{v\}$
- $|\delta^+(w)| \ge 2$
- $\exists o \in V(C) \backslash cone(v) : \exists$  w-o-Weg in C ohne v

Mit anderen Worten ist die Menge der Offenen Knoten eines Circuit Knoten v, die Menge aller Highfanoutknoten w, von welchen aus man sowohl v als auch einen Knoten außerhalb der Cone von v erreichen kann. Von dieser Menge ist v selber ausgenommen. Dies sind gerade die Highfanout-Knoten, welche durch die Kandidaten eines Knoten außerhalb von cone(v)verändert werden können. Alle Kandidaten von Knoten mit Ausgangsgrad 1 und dieser Eigenschaft, sind durch den Nachfolger-Kandidaten (welcher auch zu einem offene Knoten gehören muss), bereits eindeutig definiert.



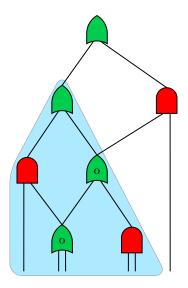


Abbildung 8: Visualisierung der Definitionen 3.2 bis  $3.4\,$ 

#### **Definition 3.5.** Klasse eines Kandidaten:

Sei k ein Kandidat auf einem Knoten v und O die Menge der offenen Knoten von v. Die Klasse class(k) ist eine Abbildung, welche jedem Element  $w \in O$  den durch k festgelegten Kandidaten auf w zuordnet.

Nach der einführenden Erläuterung lassen sich zwei Kandidaten  $k_1, k_2$  eines Knoten v mit  $class(k_1) \neq class(k_2)$  nicht miteinander vergleichen. Dies gilt auch für den Fall, wenn  $k_2$  von  $k_1$  dominiert wird, denn es ist möglich, dass dies zwar an der Stelle v gilt, jedoch nicht an allen offenen Knoten von v. Daraus folgt würde man  $k_2$  löschen, so löscht man evtl den besten Kandidaten des Outputs von C.

Um somit mit Highfanoutknoten arbeiten zu können, werden für jeden Knoten v und jede Klasse von v, in dem optimalen Algorithmus, alle nicht dominierten Kandidaten gespeichert. Daraufhin ist der noch verbleibende beste Kandidat des Outputs die beste Lösung.

Dabei wird, zur Speicherung der Kandidaten, für jede Klasse eines Knotens eine Tradeoff-Kurve angelegt. im diesem kapitel fehlt noch ein kommentar zur guten Findung aller Kandidaten an einem Knoten !!! oder kommt der zum Algorithmus weil das eher implemetierungssache ist?

#### 3.3 zu lange Kanten

Abbildung 9 veranschaulicht eine häufig auftretende Situation. Es handelt sich das Matchen über eine (auf dem Chip) sehr lange Kante. Dadurch verbessert sich evtl. die Größe des Circuits, jedoch sind nach dem Match nun zwei sehr lange Kanten auf dem Chip vorhanden, was einen großen Routing Aufwand und weitere Kosten mit sich bringt und somit eine zu vermeidende Situation ist.

Weiter unten wird eine zusätzliche Klasse von Kanten eingeführt über welche man nicht matchen darf. Diese Kanten bezeichet man als konstant. Um diese Situation zu vermeiden, wird bei der Bildung jedes Matches darauf geachtet über keine konstante Kante zu matchen.

Durch die Hinzunahme der zu langen Kanten zu den konstanten Kan-

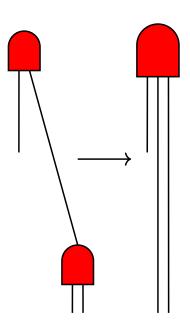


Abbildung 9: Visualisierung eines Matches über eine lange Kante

ten, kann keine optimale Lösung mehr im allgemeinen Algorithmus garantiert werden, von daher wird dies im optimalen Algorithmus nicht gemacht, bei der darauffolgenden Heuristik jedoch schon.

#### 3.4 Teilweise überflüssige Subcircuits

In der Abbildung 4 lässt sich erahnen, dass nicht unbedingt alle Inputs eines Circuits relevant sind für die Outputs. Zur genaueren Einordnung folgt eine Definition.

**Definition 3.6.** vollständig überflüssiger und teilweise überflüssiger Circuit Sei C ein Circuit mit Logischer Funktion  $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}^m$ . C wird vollständig überflüssig genannt, wenn gilt:

$$\exists y \in \{0,1\}^m \forall x \in \{0,1\}^n : f(x) = y$$

C wird teilweise überflüssig genannt, wenn es eine Teilmenge der Inputs gibt, von denen die Signale der Outputs nicht abhängen.

Die Berücksichtigung von vollständig überflüssigen Subcircuits bedeuted, dass Teile des Circuits entfernt werden und die Outputs der Inputs der Nachfolgenden Knoten an permanenten Strom gelegt oder mit der Erdung des Chips verbunden werden. Dies lässt sich jedoch weiter verbessern, da die Information an den Nachfolgenden Gates vorhersagbar ist, muss sie auch nicht verarbeitet werden. Daraus folgt eine hohe Einsparung von Kosten, jedoch birgt es ebenfalls einen großen Aufwand zur Implementierung in der aktuellen Architektur

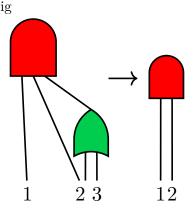


Abbildung 10: Nur Input 1 und 2 sind die relevanten Inputs

des TechnologyMappingAlgorithmus. In der Praxis ist das Vorkommen von vollständig überflüssige Circuits verschwindend gering. Von daher werden die vollständig überflüssigen Subcircuits nicht mehr behandelt und kommen auch in den Folgenden Algorithmen nicht vor und zählen auch nicht zu den Kriterien des optimalen TechnologyMapping.

Im Gegensatz dazu kommen die teilweise überflüssigen Circuits sehr wohl vor. Bei der Konstruktion eines Chips passiert dies durch das Zusammensetzen unterschiedlicher Circuits.

In den meisten Fällen werden die teilweise überflüssigen Circuits automatisch bei der Suche der Matche gefunden, da die irrelevanten Inputs nicht mehr unter den Inputs des Match auftauchen und somit beim Bau des äquivalenten Graphen verschwinden. Dies veranschaulicht Abbildung 10. Es gibt dabei jedoch noch eine Besonderheit. Wenn alle Inputs bis auf einen

Irrelevant sind, so ist das resultierende Gate des Matches entweder ein Inverter(INV) oder ein Buffer(BUFF). Ersteres lässt sich als Input-Invertierung des darüberliegenden Input-Pins speichern. Ein Buffer ist jedoch nicht unbedingt in der Library für das TechnologyMappingvorhanden und kann vermieden werden. Von daher wird in diesem Fall kein Buffer, sondern nur die Kanten vom Input des Buffers zu seinen Outputs gebaut. Dies verhindert den Einbau eines nicht nötigen Gates. Diese zusätzliche Bearbeitung läuft von nun an in jedem folgenden Algorithmus automatisch im Hintergrund und findet keine Erwähnung mehr.was ist mit dem Laufzeit statistiken? Obwohl nun das Gegenbeispiel aus Kapitel 2.2 nicht mehr gültig ist, garantiert auch hier ein optimaler Algorithmus keine bestmögliche Implementierung der eines Circuits zugrunde liegenden logischen Funktion.

#### 3.5 FPTAS und Heuristik

Mit der Einführung von Highfanoutknoten, ist die Anzahl der Kandidaten im Allgemeinen nur exponentiell beschränkt. Der Speicheraufwand lässt sich jedoch deutlich reduzieren, wenn das Ergebnis des Algorithmus um einen Faktor  $\varepsilon > 0$  von der besten Lösung abweichen darf.

#### 3.5.1 Matching Suche in polynomieller Zeit

Der Kernalgorithmus aus Kapitel 2.2 findet alle möglichen Matche eines beliebigen Knotens in polynomieller Zeit. Dies ist dort möglich, das der ungerichtete Graph Kreisfrei ist und somit jedes weitere Gate, welches mit in das Match einbezogen wird, die Anzahl der Inputs um eins erhöht. Dadurch ist die Anzahl der möglichen Matche für einen Knoten beschränkt.

Mit den in Kapitel 3.2 eingeführten Highfanoutknoten, ist es jedoch möglich, dass einem Knoten eine beliebig grosse Menge möglicher Matche zugeordnet werden können. Dies beweist Abbildung ??.

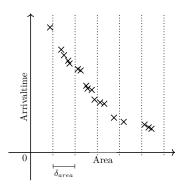
Dies bedeutet, dass es beliebig große Subciruits von C gibt, welche eine logische Funktion realisieren, die nur ein Gate braucht. Dadurch hat das Suchen aller Matche eine Laufzeit von  $\mathcal{O}(|V(C)|!)$ 

Auf realen Chips ist die Größe solcher Subcircuits stark beschränkt, woraus folgt, dass das Finden aller Matche in polynomieller Zeit möglich bleibt.

#### 3.5.2 Filtern mit Buckets

Die Kandidaten eines beliebigen Knoten sind in Tradeoffkurven, nach Klassen sortiert, gespeichert. Die Werte einer solchen Kurve lassen sich in Abschnitte (buckets) fester Größe einteilen. Dabei lässt sich eine Kurve sowohl in Delay-Buckets der Größe  $\delta_{delay}$ , als auch in Area-Buckets der Größe  $\delta_{area}$  unterteilen. Dies wird in Abbildung 11 veranschaulicht.

Wählt man die Bucketgrößen  $\delta_{area} = \delta_{delay} = \varepsilon$ , und speichert erst nur den



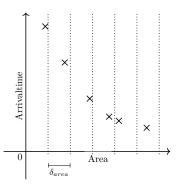


Abbildung 11: Einteilen und filtern mit Buckets

kleinsten Kandidaten in jeder Area-Bucket und von den verbleibenden nur den schnellsten in jeder Delay-Bucket, so liegen die Kosten eines Kandidaten maximal  $\varepsilon |V(C)|$  von denen des bestmöglichen entfernt. Dies gilt auch für den Output.

Die Größe eines Gates wird relativ zu einem Gate der Library gemessen und die Größe der Library wird als gegeben vorausgesetzt. Daher gilt  $\mathcal{O}(|V(C)|) \in \mathcal{O}(area(C))$ . Somit findet der Algorithmus eine Lösung mit Kosten  $c \leq (1+\varepsilon)OPT$ , wobei OPT die Kosten einer optimalen Lösung sind.

#### 3.5.3 FPTAS

für das sowieso problem gibt es einen FPTAS hier ganz wichtig auf das Polynomielle finden von matchen eingehen und dieser wird zu einer Heurisitik erweitert. Erweitert man Circuits um die bisher in diesem Kapitel beschriebenen Eigenschaften, beschränkt durch k-Highfanoutgates. So gibt es für das folgende Problem einen FPTAS(Fully polynomial time approximation scheme). Ein FPTAS ist ein Algorithmus, welcher, gegeben ein  $\varepsilon > 0$ , eine Lösung des Problems errechnet mit der Eigenschaft, dass für deren Kosten  $c \leq (1+\varepsilon)OPT$  gilt.

#### FPTAS FÜR DAS TECHNOLOGYMAPPING

Instanz: Circuit C mit einem Output, Library L mit beschränktem

 $fanin_{max}$ , maximal k Highfanoutknoten, Tradeoffparameter

 $\lambda \in [0,1]$ , Toleranz  $\varepsilon > 0$ 

**Aufgabe:** Finde einen Circuit-Kandidaten K auf C, mit Kosten  $c \leq$ 

 $(1+\varepsilon)OPT$ .

hier kommt die anahme der polynomiellen laufzeit hin diese hier grob beschreiben, bei den überflüssigen Circuits kann man darauf eingehen, dass die ohne diese auch polynomiell ist man könnte dafür die überflüssigen subcircuits auch einfach vorziehen. dann wird der tiel leichter Laufzeit des FPTAS

#### 3.5.4 Heuristik

Die Anzahl der Highfanoutknoten bestimmt maßgeblich den Speicherbedarf an Kandidaten und Laufzeit des FPTAS. Sie sind der Grund, warum sich der FPTAS für eine Anwendung des TechnologyMappingauf einem gesamten Chip nicht eignet.

Von daher ist es ein naheliegender Ansatz für eine Heuristik, an jedem Highfanoutknoten nur einen Kandidaten zu speichern. Es ist jedoch nicht trivial, welchen man dort auswählt. Die Auswahl eines solchen Verfahrens wird in Kapitel 4 ausführlich behandelt. Im Folgenden wird Beipielhaft eines dieser Verfahren erläutert.

Ist an jedem HIghfanoutknoten ein Kandidate gewählt, so lässt sich der noch bestmögliche Circuit Kandidat schnell errechnen, da für jeden Knoten nur eine Klasse (und Tradeoffkurve) vorhanden ist. als nächstes kommt der algorithmus (ausführlicher als in der BA fasse FPTAS und Heuristik zusammen) und seine erklärung was ist mit einer Laufzeit schranke ??? weil ich will ja sowieso eine für die premapping heuristik angeben

#### 3.6 required Arrivaltimes

Oben wurde bereits der Begriff der Arrivaltime eines Knoten eingeführt. Dies ist die Zeit, zu welcher das letzte Signal bei einem Knoten ankommt. Diese Werte sind für die Inputknoten eines Circuits C gegeben und werden von dort aus (unter Hinzunahme von Wire-, Gate- und Inverter-Delay) für jeden Knoten von C (in topologischer Reihenfolge) errechnet.

Im Design Prozess eines Chips, gibt es neben der tatsächlichen Arrivaltime auch eine gewünscht Arrivaltime RAT (required AT), welche an den Outputs eines Graphen gegeben ist und ähnlich zur AT durch C propagiert wird. Somit ist sowohl AT und RAT eine Funktion auf V(C).

Der Vollständigkeit wegen folgt hier nocheinmal die genaue Definition der RAT.

#### **Definition 3.7.** RAT:

Sei C ein Circuit und  $v \in V(C) \setminus Outputs(C)$ . Die RAT (required arrivaltime) an v ist definiert durch:

$$RAT(v) := \min_{\substack{(v,x) \in E(C), \\ i: inputs(x)[i] = v}} \{RAT(x) - d_{w(v,x)} - d_{gate(x)} - d_i \mathbb{1}_{inv_x(i)}\}$$

Die RAT der Outputs wird hierbei (wie das Delay der Inputknoten) als gegeben angenommen.

In der Praxis kommen Signal oft später an als gewünscht. Der Betrag des Slack slack(v) := RAT(v) - AT(v) gibt, wenn  $slack(v) \le 0$ , an um wie viel Zeit sich das letzte Signal an v verspätet. Somit ist es viel Interessanter einen gegebenen Circuit hinsichtlich des negativen Slacks zu verbessern. Hieraus ergeben für einen Circuit die beiden folgenden Werte:

- Worst-Slack (WS): Wert des kleinsten Slacks für einen Knoten auf dem Circuit.
- Sum-of-Negative-Slacks (SNS): Summe aller negativer Slacks der Outputs eines Circuits.

Letzteres ist in der Praxis gefragter, da eine sehr gute Verbesserung der SNS eine Verbesserung des WS in der Regel mit einschließt.

hier passt sehr gut rein Lukas FPTAS zu erwähnen da er auf den schlechtesten Pfad angewendet wird, war die anzahl der Highfanout gates vorhersebar? -; in den nächsten absatz mit einbauen

Angenommen man betrachtet einen Chip, dann lässt sich auf diesem ein Knoten v finden, an welchem der WS angenommen wird. Sei C der Circuit, welcher nur aus dem Gate von v besteht. Füge nun zu v in C den Input von v hinzu, welcher den größten negativen Slack besitzt. Dies wiederhole man für das neu hinzugefügte Gate, bis man an einem Input des Chips gelangt oder der Slack nicht mehr negativ ist.

Hieraus entsteht ein Circuit C welcher einen Output hat und aus einer hintereinangeschalteten Kette von Knoten besteht. Dieser lässt sich nun mit geeigneten Algorithmen füge hier mal ein Beispiel oder einen Verweis an zu einem äquvalenten Circuit C', mit geringerer Tiefe(schon definiert(wenn nein nötig?), umformen. Dieser lässt sich dann mit Delay optimierenden TechnologyMapping(in polynomieller Laufzeitzeigen?) umbauen und wieder in den Chip einbauen. Der Große Vorteil von diesem Vorgehen sind überschaubar große Instanzen und eine Beschleunigung des gesamten Chips in sehr schneller Zeit. Der Nachteil jedoch ist, dass ein Chip oft sehr viele Wege besitzt, welche einen schlechten Slack realisieren und man somit den Chip nur inkrementell beschleunigt.

Eine weitere Herangehensweise für das TechnologyMappingist es einen Circuit dahingehend zu optimieren, dass die SNS des Outputs minimiert wird. Dies ist jedoch bei den bisher betrachteten Circuits äquivalent zur Optimierung nach AT, da nur Instanzen mit einem Output betrachtet wurden und RAT für diesen eine Konstante ist.

#### 3.7 pinabhängiges Delay

Bis zu diesem Punkt war das Delay eine Gates als eine nicht negative Reelle Zahl definiert. Die meisten Gates besitzen mehr als einen Input. Die Signale der Inputs brauchen nicht alle dieselbe Zeit um zum Output zu gelangen. Physikalisch werden die Signale der Inputs zwar alle miteinander verrechnet, jedoch geschieht dies nicht gleichzeitig und somit müssen nicht alle Signale zur selben Zeit an den Inputs anliegen.

Die spätere Ankunftsmöglichkeit lässt sich durch einen kleineren Delaywert, spezifisch für diesen Input, realisieren. Denn wenn das Signal schneller durch das Gate gelangen kann, so brauchst es auch nicht so früh vorhanden zu sein, wie die anderen.

Von nun an ist das Delay eines Gates  $g: d_g \in \mathbb{R}^{arity(g)}_{\geq 0}$ . Für das Technology-Mappingist dies eine weitere Möglichkeit der Verbesserung, denn viele Gates der Library besitzen mindestens eine Teilmenge von Inputs welche logisch symmetrisch aufgebaut sind. Diese lassen sich beliebig permutieren. Durch die unterschiedlichen Delay-Eigenschaften der Inputs kann eine solche Permutierung das Dealy des Outputs verbessern. Aus diesem Grund ändert sich die AT eines Knotens wiefolgt:

### **Definition 3.8.** AT mit pinabhängigen Delay:

Sei C ein Circuit und  $v \in V(C)$ . Die AT von v mit pinabhängigen Delay ist wiefolgt definiert:

$$AT_p(v) := \max_{i \in inputs(v)} \{ d_{gate(v),i} + \mathbb{1}_{\{inv_g(i)\}} d_i + AT_p(i) + d_{w(k,i)} \} \}$$

Im Folgenden sei mit AT immer das pinabhängige Delay gemeint.

In einem Match ist diese Information bereits abgespeichert, da die Inputs eines Matches mit einer Bijektion an Knoten des Circuits geknüpft werden. Um die Optimilität des, noch vorzustellenden, allgemeinen Algorithmus zu wahren, wird ein Kandidat für jede mögliche Permutation der Inputs gespeichert, falls dieser nicht dominiert ist.

Nach aktuellen Stand gilt  $fanin_{max} \leq 4$ . Das ist klein genug um auch bei der Heuristik die max  $fanin_{max}$  Permutation bei der Wahl eines Matches in Betracht zu ziehen.

### 3.8 Mehrere Outputs

Wie in der Einleitung beschrieben, ist es das Ziel dieser Arbeit eine Heuristik für das TechnologyMappingzu entwickeln, welche auf großen Teilen eines Chips lauffähig (bezüglich Laufzeit) ist. Da ein solcher Chip mehr als nur einen Output-Pin besitzt, lässt er sich in zusammenhängende Circuits unterteilen, welche mehr als einen Output-Knoten besitzen. Folgende Umbauten sind notwendig um mit den Kern-Algorithmus auch diese Instanzen verbessern zu können.

Als erstes fällt auf, dass sich, wenn der Algorithmus für jeden Knoten die Kandidatenmenge errechnet hat, nicht einfach der beste Kandidat für den Output aus seiner Tradeoff-Kurve auswählen lässt. Dieser besitzt bei mehreren Outputs nämlich In der Regel offene Knoten. Jedoch ist bereits bekannt wie man mehrere Kandidaten auswählt, sodass diese sich an den sich überschneidenden Knoten gleichen. Somit lässt sich ein Circuit mit den bekannten Mitteln ein Circuit konstruieren, welcher eine Kostenfunktion hinsichtlich Größe und WS optimiert.

Die zweite Änderung hat sich dadurch bereits angekündigt. Bisher wurde das Delay eines Circuits C optimiert, indem das Signal des einen Outputs nach dem Umbau früher ankommt. Dies lässt sich auf einen Circuit mit mehreren Outputs übertragen. Da es mehrere Signale gibt wählt man den Kandidaten des Outputs mit dem größten negativen Slack zuerst und die anderen folgen sortiert der Größe ihres Slacks nach (absteigend). Dies garantiert jedoch nicht, dass der WS des Circuits nach dem Umbau besser ist als vorher, da evtl der Knoten der vorher den WS bildete besser wird, jedoch ein anderer Output könnte durch diesen Umbau schlechter werden.

Um dieses Problem zu umgehen, verändert man C vor dem TechnologyMappingdurch das verbinden aller Outputs mit einem virtuellen Gate, mit nur einem möglichen Match (dem Gate an sich). Der veränderte Circuit lässt sich nun wie im Kern-Algorithmus optimieren und es wird automatisch das gerade beschriebene Problem gelöst.

Wie bereits in Kapitel 3.6 erwähnt ist es in der Praxis profitabler die SNS des Circuits zu verbessern, anstatt den WS.

Also muss aus den Kandidatenmengen der Outputs derjenige Circuit-Kandidat gebaut werden, welcher die SNS minimiert.

Dieses Kriterium ersetzt, von diesem Punkt an, das der Delay-Optimierung in der Kostenfunktion.

Des Weiteren müssen nach dem TechnologyMappingnoch alle Outputs, mit der bis zu ihnen realisierten Logischen Funktion, vorhanden sein. Daraus folgt, dass über einen Output-Knoten, welcher in dem Circuit noch mindestens einen Nachfolger hat, nicht gematcht werden darf, denn sonst würde ein nicht erlaubter Seitenoutput entstehen.

Die lässt dadurch bewerkstelligen, dass man eine seiner ausgehenden Kanten als nicht matchbar besserer name oben festlegen (bei den langen Kanten deklariert, wie das bereits bei den zu langen Kanten geschehen ist.

indem unterkapitel noch mehr bilder bzw schönerer aufbau ist nämlich aktuell viel text!!

### 3.9 Allgemeiner Algorithmus

Es folgt ein optimaler TechnologyMappingAlgorithmus welcher auf allgemeinen Circuits arbeitet. TODO Laufzeit und Korrektheitsbeweis? was ist mit dem faninmax? vielleicht nett zur laufzeit berechnung aber eig hier noch nicht relevant erwähnen woraus die kostenfunktion besteht bzw nur tradeoffparameter nehmen!!!!

hab ich schon erwähnt wie man Kandidaten auswählt?

```
Algorithmus: (allgemeines) TechnologyMapping
```

```
Input: Circuit C, Library L, fanin_{max}
 1 foreach Knoten v \in V(C) in topologischer Reihenfolge do
       tradeoff\_curves[v][] \leftarrow \emptyset
 2
 3
       berechne die offenen Knoten O von v
       classes[v] \leftarrow get\_all\_classes(v, C, O, tradeoff\_curves)
       berechne alle (invertierten) Matche auf v
 5
       foreach Match m auf v do
 6
          foreach A \in classes[v] do
 7
              foreach Kandidat k von v mit m, der A respektiert do
 8
 9
                  dom \leftarrow k.is\_dominated(tradeoff\_curves[v][A])
                  if !dom then
10
                     tradeoff\_curves[v][A].push\_back(k)
11
12 K \leftarrow best\_circuit\_candidate(tradeoff\_curves, C.outputs, c)
13 return K
```

#### Korrektheit:

Es gilt zu zeigen, dass dies ein optimaler Algorithmus ist.

Der Algorithmus speichert für jeden Knoten alle, bis auf die dominierten, möglichen Kandidaten. Daraus folgt, dass in Schritt 12 zur Auswahl des besten Circuit-Kandidaten, jeder mögliche nicht dominierte Umbau zur Verfügung steht und dort nur der kostengünstigste, bezüglich c, ausgewählt wird.

TODO vergleich mit Lukas und geeignete Quellen einfügen!! besonders für den Hautalgorithmus wie bei Lukas nach welchem Vorbeild der entstanden ist

#### Laufzeit:

Da, wie bereits oben erwähnt, das TechnologyMappingauf allgemeinen Circuits ein NP-vollständiges Problem ist, folgt, dass es unwahrscheinlich ist mit diesem Algorithmus größere Instanzen, in aktzeptabler Zeit, lösen zu können.

Die Anzahl der Durchläufe der ersten Schleife sind |V(C)|. Die Schritte 2,3 und 5 sind ebenfalls in  $\mathcal{O}(|V(C)|)$  errechenbar. genaue werte und begründung angeben angeben!

Des Weiteren gilt, dass die Schleife aus Zeile 6 für jeden Knoten maximal 2|L| mal aufgerufen wird.

Die Anzahl der Kandidaten steigt, dank der beliebigen Anzahl an Highfanoutknoten exponentiell, weshalb die Größe von *classes* und die somit auch die Schleifendurchläufe in Zeile 7 nur polynomiell begrenzt sind. Daraus folgt sowohl eine nicht polynomielle Laufzeit als auch eine nur exponentiell beschränkte Größe des verbrauchte Speichers. genauer?.

Folgende Abbildung veranschaulicht das exponentielle Wachstum der Kandidatenmenge, indem für jeden Knoten die Anzahl der Kandidaten in Verbindung mit seinem topologischen Index angibt. hier Beispielbild mit beschriebenen eigenschaften

# 4 Premapping von Highfanoutknoten

Der exponentielle Anstieg der Kandidatenmenge wird, wie oben gezeigt, durch die Highfanout-Knoten verursacht. Daraus folgt, dass ein sehr großes Laufzeit Potenzial in der Reduzierung der Kandidaten für diese Knoten liegt. Die Kandidatenmenge eines jeden Highfanoutknotens wird, wie bereits in Kapitel 3.5.4 geschehen, auf eins reduziert. Diese Routine wird auch das Premapping der Highfanoutknoten genannt. Dadurch folgt, dass jeder Knoten des Circuits C nur noch eine Klasse an Kandidaten besitzt, denn alle offenen Knoten seiner cone sind Highfanoutknoten und somit festgelegt. Die Kandidatenmenge der Outputs, welche noch Nachfolger  $o \in C$  haben, wird ebenfalls auf einen Kandidaten reduziert. Dies verhindert das Klonen in cone(o), da auch die nicht offenen Knoten von o von allen Knoten der Menge  $O := \{v \in Outputs(C) : o \in cone(v)\}$  mit einem Kandidaten belegt werden.

Nun lässt sich der bestmögliche Kandidate eines jeden Outputs, ohne Nachfolger, finden, indem die einzige verbleibende Tradeoffkurve nach dem Kandidaten mit den geringsten Kosten gesucht wird. Dadurch ist das Finden des noch bestmöglichen Circuit Kandidaten ohne Laufzeiteinbußen möglich.

Daraus folgt, dass der zu wählende Circuit-Kandidat eindeutig ist, sobald jedem Highfanoutknoten ein Kandidat zugewiesen wurde. Dadurch hat die

Wahl der Premapping Routine eine zentrale Bedeutung der Heuristik. Im folgenden werden drei verschiedene Routinen vorgestellt und auf ihre Eigenschaften eingegangen. Genauere Informationen über die Unterschiede der Resultate dieser Routinen finden sich in Kapitel 9.

- 4.1 triviales Premapping
- 4.2 erweiteretes Premapping
- 4.3 Premapping durch Schätzen

#### ZSFG:

- 1. Vorstellung der Probleme: die da wären :
- -Tradeoffprobleme -¿ mehrere Kandidaten müssen gespeichert werden. Einführung der Tradeoff Kurven und Bucket Filterungen (wir sind noch in Bäumen dies lässt sich also noch in den Alg einbauen und beweisen)
- -Highfanoutgates - $\dot{\iota}$  Einführung von Klassen widerrum erweitern des TM algos
- =¿ bei konstantem k gibt es zu diesem Punkt noch einen FPTAS ¿ besonder hilfreich auf schlechteste Wege pfade kann auch erst später erwähnung finden
- -required ATs einführen und sagen dass sie aktuell noch äquivalent sind -multiple outputs -¿ sagen, dass optimieren auf AT nicht mehr Funktioniert da es nicht nur eine AT gibt. man könnten die latest AT verbessern, das ist jedoch nicht das was man möchte. neue Kosten optimierung mit RAts definieren. Des weiteren nicht vergessen, dass über outputs nicht gematcht werden darf
  - -reduandant gates -¿ soll das hier hin? oder weiter nach oben??
- =¿ Algorithmus verallgemeinern sagen dass er den besten umbau liefert da er alles speichert, aber nicht unbedingt die generell beste Implementierung der logischen Funktion da (unter anderem keine gates auseinandergebaut werden und erste Heuristik bauen, welche auf Area und RATs hin optimiert

# 5 Präprozessing zusätzliche Addons

-auseinanderbauen von gates: Beispiele und einegehen auf vor und nachteile genauerer bezug in der Laufzeitanalyse auch hier noch ein gegenbeispiel finden, dass auch alleine mit dem auseinanderbauen und dem allg Algorithmus nicht unb die best möglich lösung gefunden werden kann auch hier ein Gegenbeispiel finden und in einen Satz einbauen.

-errechnen kleiner optimal gelöster häufig vorkommender Instanzen -¿ unabh. von dem auseinanderbauen. -¿ lässt sich beweisen dass eine auseinandergebaute instanz sich in das bestmögliche Machting matchen lässt?

# 6 Weitere Optimierungskriterien

- -Vt Optimierung -; Optimierung bezüglich Power
- -Layer assignment -¿ sehr kurz und grobe übersicht kommt später noch auf die TODOs

# 7 Version der Heuristik, welche obige Kriterien beherzigt

### 8 Ressource Sharing

In diesem letzten theoretischen? Kapitel wird ein anderer Ansatz für eine Heuristik vorgestellt. Da dieser Ansatz noch nicht implementiert wurde, wird in Kapitel 9 nicht darauf eingegangen.

Es folgt die allgemeine Definierung des Problems und daraufhin eine Heuristik, welche sich dieses Problem zunutze macht.

Es handelt um das Ressource Sharing Problem. Eine Instanz des Problems besteht aus einer endlichen Menge von Kunden  $\mathcal{C}$ , von denen jeder eine Aufgabe erledigen möchte. Jeder Kunde  $c \in \mathcal{C}$  besitzt ein Spektrum an Vorgehensweisen  $\mathcal{B}_c$  um seine Aufgabe zu meistern. Hierbei ist  $\mathcal{B}_c$  (Block genannt) eine konvexe Menge. Jede Vorgehensweise benötigt Ressourcen für seine Umsetzung. Sei  $\mathcal{R}$  die endliche Menge aller verschiedener Ressourcen. Des Weiteren sei g die Funktion, welche für jeden Kunden c und  $b_c \in \mathcal{B}_c$ , die benötigte Menge einer jeden Ressource  $r \in \mathcal{R}$  angibt. Es gilt also  $\forall c \in \mathcal{C}: g_c: \mathcal{B}_c \to \mathbb{R}^{\mathcal{R}_+}$ .

Ziel des Ressource Sharing ist es nun jedem Kunden eine Vorgehensweise zuzuordnen, mit welcher er seine Aufgabe erledigt. Dabei wird über den Verbrauch der am meisten genutzten Ressource minimiert.

Es folgt die formale Definition des Problems.

#### Ressource Sharing Problem

**Instanz:** endliche Mengen  $\mathcal{R}$  von Ressourcen und  $\mathcal{C}$  von Kunden.

Einen, durch eine endliche Menge repräsentierten, konvexen Block  $\mathcal{B}_c \, \forall c \in \mathcal{C}$  und eine konvexe Funktion  $g_c : \mathcal{B}_c \to \mathcal{B}_c$ 

 $\mathbb{R}_+^{\mathcal{R}} \, \forall c \in \mathcal{C}$ 

**Aufgabe:** Finde  $\forall c \in \mathcal{C}b \in \mathcal{B}_c$ , welche  $\lambda^*$  so nah wie möglich kommen.

Dabei gilt

$$\lambda^* := \inf \{ \max_{r \in \mathcal{R}} \sum_{c \in \mathcal{C}} (g_c(b_c))_r | b_c \in \mathcal{B}_c \forall c \in \mathcal{C} \}$$

hier vielleicht noch ein einfaches beispiel (evtl) und auf jeden fall der Verweis zum paper und ein Vermerk auf die Benutzung im Chipdesign daraufhin der TechnologyMappingansatz! theoretische Beweise?

### 9 Laufzeitanalyse

In diesem Kapitel werden, die vorgestellten Algorithmen bezüglich Laufzeit und Güte analysiert. Vorher jedoch ein paar Angaben zu den bearbeiteten Instanzen, um die Ergebnisse der Algorithmen besser einordnen zu können.

#### 9.1 Struktur realer Instanzen

Die Instanzen eines Chips sind im Folgenden alle maximal zusammenhängenden, mit TechnologyMappingvollständig bearbeitbaren Circuits eines Chips. Da auf einem Chip, beispielsweise durch Register, gerichtete Kreise entstehen, oder Bauteile existieren, welche nicht in der Library vorhanden sind, lässt sich der Logik Graph eines Chips nicht vollständig mit dem TechnologyMappingAlgorithmus verarbeiten.

Das Chipdesign besteht aus sehr vielen Routinen, welche aus einem Bauplan einen produzierbaren Chip designen. Auf diesem Weg gibt es viele Zwischenstände (Snapshots genannt). Alle gestesteten Chips wurde auf dem Stand desgleichen Snapshots bearbeitet. Dadurch lassen sich die Verbesserungen von Instanzen durch die Algorithmen miteinenander vergleichen, auch wenn Sie von verschiedenen Chips stammen.

Die Folgenden Angaben betreffen den Mittelwert aller getesteter Instanzen. anzahl getesteter instanzen

- Anteil Highfanouknoten
- Anteil Outputs / Anteil outputs mit Nachfolger
- Anteil an Inputs

Abbildung ?? zeigt die Verteilung der getesteten Instanzen hinsichtlich der Größe ihrer Knotenmenge.

Kandidaten menge kann hier noch hin also menge der Kandidaten abh von Knotenmenge bzw anzahl highfanoutknoten und abh von den oben genannten zusatzfeatures (zb pinabh. delay, Library )

und dass vielleicht die varianz (anhand eines bildes beweisen?) des hoghfanout anteil ziemlich klein ist und somit Knotenmenge und highfanoutmenge ansich ausreichend aussagekräftig sind

#### 9.2 Analyse der Ergebnisse

Funktion/Abbildung mit Tradeoff in bezug zur Kostenersparnis irgendwo muss noch erwähnt werden, dass die größe/vt und at werte am anfang gleich gesetzt werden

### 9.3 Laufzeitanalyse

Aus der theoretischen Laufzeitschranke aus Kapitel 3.5.4 folgt, dass die Laufzeit maßgeblich von der Menge der Highfanoutknoten abhängt. Andere Faktoren wie das Aufteilen von Gates, die Größe der Library oder die Wahl der Premapping subroutine spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Dies verdeutlicht die Übersicht??.

Bezüglich der Größe der Library lassen sich die Chips, abzüglich weniger Unterschiede in zwei Gruppen einteilen. Die markierte Teilmenge der Abbildung ?? entspricht der Menge der (so genannten) komplexen Gates. Ein Chip lässt sich in der Praxis, abhängig davon ob er de komplexen Gates grundsätzlich erlaubt, einer der zwei Gruppen zuordnen. Diese Unterscheidung findet sich ebenfalls in Abbildung ??.

### 10 Fazit und Ausblick